

適用規格																
定 格	使用温度範囲	-55 °C ~ +85 °C (注1)	保存温度範囲	-10 °C ~ +60 °C (注2)												
	電 圧	AC 100 V	保存湿度範囲	40% ~ 70% (注2)												
	電 流	0.5 A(信号部) (注3) 3.0A(MF端子部)	使用湿度範囲	相対湿度85%以下 (但し結露の無いこと)												
性 能																
項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT												
構造	外觀, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。													
	表示	目視にて確認する。														
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	信号部 : 90 mΩ以下 MF端子部 : 30 mΩ以下	○ -												
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○ -												
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○ -												
機 械 的 性 能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 60.0 N以下 引抜力 6.0 N以上	○ -												
	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -												
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -												
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。		○ -												
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗: 信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下	○ -												
	温度サイクル	温度 -55 → +85 °C 時間 30 → 30 分を 5 サイクル試験する。 (槽の移し変え時間は2~3分)	② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○ -												
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2 °C 75±5%RH 96 時間放置する。 (試験規格: JIS C 60068)	はなはだしい腐食がないこと。	○ - ○ -												
	はんだ耐熱性	リフローの場合: ピーク温度 MAX260°C 220 °C以上 60秒以内	外觀の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○ -												
		はんだごての場合: こて温度 360°C はんだ付け時間 5 秒以内		○ -												
はんだ付け性	はんだ温度 240±3 °C, 浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○ -													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">△の数</td> <td style="width: 25%;">訂正記事</td> <td style="width: 15%;">設計</td> <td style="width: 20%;">検図</td> <td style="width: 25%;">年月日</td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	△					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日											
△																
備考			承認	HS. OKAWA	12.01.25											
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	KI. HIROKAWA	12.01.25											
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	TH. SANO	12.01.25											
注3. 1端子当たりの定格電流となります。			製 図	TH. SANO	12.01.25											
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。																
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC4-159563-00												
HRS	製品規格表		製品名	FX18-100P-0.8SV												
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL579-0019-8-00	△ 1/1											